

چکیده

نیم رساناهای مغناطیسی رقیق به دلیل قابلیت به کارگیری آنها در دستگاههای الکترونیک اسپینی، اخیراً مورد توجه ویژه‌ای قرار گرفته‌اند. از سویی دیگر، بسیاری از کمیت‌های فیزیکی ساختارهای نیم رسانائی در ابعاد نانو، از قبیل سیم‌های کوانتومی، رفتار بسیار متفاوتی با همان کمیت‌ها اما در ساختارهای با ابعاد بزرگ دارند. عامل اصلی این تغییر در کمیت‌های فیزیکی، تغییر در چگالی حالتهای آنهاست. در این پژوهش، ضمن مدل سازی یک نانوسیم نیم‌رسانای مغناطیسی رقیق، حالتهای الکترونی آن را مورد مطالعه قرار داده‌ایم. با استفاده از تقریب پتانسیل همدوس (CPA) برای بی‌نظمی شیمیائی و مغناطیسی، و همچنین روش بستگی قوی در تقریب نزدیکترین همسایه، اثر تراکم ناخالصی و قدرت برهمکنش تبادل الکترون با یون‌های مغناطیسی را بطور گسترده‌ای روی چگالی حالتهای الکترونی نانوسیم‌های مغناطیسی بررسی کرده‌ایم. نتایج حاصل از محاسبات عددی نشان می‌دهد که تزریق ناخالصی‌های مغناطیسی می‌تواند جایگزیدگی الکترون‌ها را بسیار تضعیف نموده، تحرک‌پذیری آنها را افزایش دهد، و در مقایسه با ناخالصی‌های غیر مغناطیسی تأثیر بیشتری روی حالتهای الکترونی داشته باشد. با افزایش قدرت برهمکنش تبادل و همچنین میزان تراکم ناخالصی‌های مغناطیسی، جایگزیدگی تقریباً از بین رفته و پهنای طیف حالتهای الکترونی افزایش می‌یابد. این ویژگی‌ها، برتری نانوسیم‌های مغناطیسی را نسبت به نوع غیرمغناطیسی نشان می‌دهد. نتایج بدست آمده بخوبی می‌تواند ضرورت تحقیق و تولید نسل جدیدی از دستگاههای نانو الکترونیک مبتنی بر نیم‌رساناهای مغناطیسی را نشان دهد.